

LORENZO PAMPALONI

INFORMAZIONI PERSONALI

- Nazionalità:
- Data di nascita: 26/11/1976
- Luogo di nascita: Firenze
- Residenza:
- Numero di telefono:
- Indirizzo Email:

IMPIEGO ATTUALE

Impiegato a tempo indeterminato presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze in qualità di Ispettore Metrico, dal Settembre del 2008 e responsabile dell'ufficio Metrologia Legale e Sicurezza Prodotti dal 2011

TITOLI DI STUDIO/FORMAZIONE

- Iscritto dal 2013 nell'elenco degli esperti per la verifica dei requisiti degli Organismi che eseguono la verifica periodica ai sensi del DM 75 del 16 aprile 2012, con incarichi;
- Iscritto dal 2013 nell'elenco degli esperti per la verifica dei requisiti dei laboratori che eseguono la verifica periodica ai sensi del DM 31 e del DM 32 del 18 gennaio 2011, con incarichi;
- Iniziativa di studio Maggioli Formazione, partecipazione al corso *"Scrivere per farsi capire, strategie e applicazioni per il web"* 7 giugno 2010
- Iniziativa di studio Maggioli Formazione, partecipazione al corso *"Scrivere per farsi capire, come garantire chiarezza e semplicità al linguaggio amministrativo"* 13 maggio 2010
- Partecipazione al Corso di formazione, organizzato da Assist internamente alla Camera di Commercio, per Posizioni Organizzative (Aprile-Giugno 2010)
- **Corso di Formazione per Valutatori Sistemi Gestione Qualità:** frequentazione del corso organizzato da AICQ e superamento degli esami finali, con rilascio dell'attestato in data 4 Dicembre 2009
- **Qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria** a seguito del giuramento prestato presso il Tribunale di Firenze
- **Qualifica di Ispettore Metrico** conseguita in data 29 Aprile 2009 presso l'Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma.
- **Dottorato in Controlli Non Distruttivi** conseguito il 25 Marzo 2009 presso l'Università degli Studi di Firenze, con la tesi dal titolo: *"Applicazione di segnali modulati nell'ecografia medica e nei controlli non distruttivi: analisi, sperimentazione e realizzazione di metodi innovativi di focalizzazione"*
- **Abilitazione alla professione di Ingegnere** conseguita in data 15 Luglio 2005
- **Laurea in Ingegneria Elettronica** (5 anni, vecchio ordinamento, specializzazione **Elettronica Numerica**), conseguita il 28 Aprile 2005 presso l'Università degli Studi di Firenze, con la tesi dal titolo: *"Tecniche di focalizzazione per fasci ultrasonici: Analisi teorica e"*

risultati simulati su segnali a radiofrequenza” con voto finale 104/110

- **Diploma di Maturità Scientifica** conseguito presso il Liceo Scientifico Antonio Gramsci, Firenze, con votazione **42/60**

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- **Gennaio 2008 – Settembre 2008:** impiegato a tempo determinato GE Oil&Gas presso la sede di Firenze mediante ditta esterna (Granite International Service), nel ruolo di Supporto alla Riclassificazione delle Metriche per il Sourcing.
- **Gennaio 2006 – Dicembre 2008:** svolgimento Dottorato in Controlli Non Distruttivi presso Laboratorio Ultrasuoni e Controlli Non Distruttivi, della Facoltà d’Ingegneria di Firenze.
- **Coautore** dell’articolo **“Synthetic Aperture Focusing of Echographic Images by Means of Pulse Compression”** (Elena Biagi, Marco Scabia, Lorenzo Pampaloni, Leonardo Masotti) presentato al 29th International Symposium on Acoustical Imaging in Giappone.
- **Correlatore** per il lavoro di tesi svolto presso il laboratorio di Ultrasuoni e Controlli non Distruttivi della facoltà di Ingegneria (FI) dall’ Ing. Giacomo Giorgi sull’implementazione di tecniche innovative di focalizzazione per immagini ecografiche, dal titolo: *“Tecniche di focalizzazione ad apertura sintetica per immagini ad ultrasuoni tramite equalizzazione di fase: studio, simulazione e caratterizzazione sperimentale”*
- **Correlatore** per il lavoro di tesi svolto presso il laboratorio di Ultrasuoni e Controlli non Distruttivi della facoltà di Ingegneria (FI) dall’ Ing. Costanza Caviccholi sulla **realizzazione di un sistema di acquisizione ad ultrasuoni per controlli non distruttivi**, dal titolo: *“Nuovi metodi di focalizzazione di fasci di ultrasuoni per analisi di materiali stratificati: implementazione e sperimentazione”*
- **Collaborazione coordinata e continuativa** svolta per il dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni della facoltà di Ingegneria (FI), riguardante il **progetto di un nuovo ecografo impiegante un metodo originale per la rilevazione di patologie nei tessuti biologici molli** (Giugno/Dicembre 2005)
- **Docenza del corso** di Elettronica per gli specializzandi di Medicina Nucleare presso la facoltà di Ingegneria (Settembre 2005-Febbraio 2006)
- **Docenza del corso** Sensori e Rivelatori per gli specializzandi di Ingegneria Elettronica (Gennaio-Giugno 2007)
- **Incaricato**, per conto della CCIAA di Firenze, delle attività di abilitazione e sorveglianza dei laboratori che effettuano la verifica periodica di strumenti di misura e sul corretto funzionamento ed utilizzo di strumenti di misura in uso
- **Controlli tecnici e sorveglianza**, per conto della CCIAA di Firenze, sulle Officine autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico al

montaggio, riparazione e controlli periodici dei cronotachigrafi di tipo CEE

- **Controlli tecnici e sorveglianza**, per conto della CCIAA di Firenze, sui Centri Tecnici autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico al montaggio, riparazione e controlli periodici dei Tachigrafi Digitali;
- **Attività di indagine** delegata dall'Autorità Giudiziaria negli ambiti della Metrologia Legale;
- **Controlli tecnici**, per conto della CCIAA di Firenze, sulle attività di confezionamento dei prodotti;
- **Consulenza alle imprese e sorveglianza sul mercato**, per conto della CCIAA di Firenze, nell'ambito dell'etichettatura e sicurezza dei prodotti (Giocattoli, Prodotti elettrici, Tessili, Calzature, Dispositivi di protezione individuale, Codice del Consumo)

COMPETENZE ACQUISITE

- Conoscenza dei sistemi di **gestione per processi**, del **project management** e delle tecniche di programmazione e controllo
- Conoscenze specifiche nell'ambito degli **ultrasuoni** e dei sistemi ultrasonici (ecografia, rilevamenti di distanza), sviluppate durante lo svolgimento della tesi e la collaborazione con Esaote S.p.a per l'implementazione di metodi diagnostici e tecniche di focalizzazione innovative (basate su sistemi SAR). Conoscenze di base per i **laser a semiconduttore**
- Conoscenze di base dell'**elaborazione dei segnali** e delle **comunicazioni elettriche**, sviluppate tutto il percorso di studi e specificatamente nello svolgimento dell'attività di dottorato, in relazione ai segnali presenti nelle apparecchiature ecografiche
- Conoscenza delle norme ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025
- Conoscenza delle direttive europee 2009/48/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 94/11/CE
- Conoscenza del regolamento UE 1007/2011

Software:

- Sistema operativo **Windows XP/Vista/7/8**
- Applicativi Office: **Word, Power Point, Excel, Access**
- **Matlab**: elaborazione di acquisizioni ultrasoniche (reali e simulate), realizzazione di filtri di segnale e analisi d'immagine.
- Linguaggi di programmazione: **C e Visual C++.Net, Visual Basic**
- Software grafici: **CorelDraw, Photoshop**
- **Field II**: programma di simulazione in ambiente Matlab per sistemi ultrasonici.

LINGUE STRANIERE

- **Inglese** - buona comprensione, buona conoscenza scritto, parlato a livello scolastico. Approfondimento svolto mediante corso di lingue presso l'Ateneo di Firenze (2007).

Vi autorizzo all'utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e del D.LGS. 196/03.